



#3307

# Microscopía

ANÁLISIS MORFOLÓGICO Y ESTRUCTURAL DE MATERIALES

## DESCRIPCIÓN

La Microscopía Óptica, Electrónica (SEM, TEM) y de Fuerza Atómica (AFM) pueden emplearse para estudiar la microestructura, morfología, tamaños de partículas y presencia de defectos en los materiales a escala micrométrica y nanométrica.

## EQUIPAMIENTO DISPONIBLE

- Microscopio Óptico Karl Zeiss, modo reflexión, transmisión y polarización, con platina calefactora (Mettler)
- Microscopio Electrónico de Barrido SEM JEOL EVO 40-XVP acoplado con detector para Microanálisis Dispersivo de R-x (EDS)
- Microscopio Electrónico de Transmisión (TEM) Jeol 100CX
- Microscopio de Fuerza Atómica (AFM) Nanoscope (Digital Instruments)

## VENTAJAS

Además de las imágenes de alta resolución, estas técnicas analíticas pueden proporcionar información valiosa para actividades de I + D y el análisis de las fallas de los materiales.

## APLICACIONES

Nanopartículas | Películas poliméricas delgadas y laminados multicapas | Recubrimientos | Compuestos y nanocompuestos | Huecos, grietas y defectos | Estructura cristalina.

## CONTACTO

Oficina de Transferencia  
de Tecnología

✉ [ott@plapiqui.edu.ar](mailto:ott@plapiqui.edu.ar)

🌐 [plapiqui.edu.ar/ott](http://plapiqui.edu.ar/ott)

☎ +54 291 4037200 - Int 217/214

📞 +54 9 291 4261644